

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**60749-5**

Première édition  
First edition  
2003-01

---

---

**Dispositifs à semiconducteurs –  
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –**

**Partie 5:  
Essai continu de durée de vie sous température  
et humidité avec polarisation**

**Semiconductor devices –  
Mechanical and climatic test methods –**

**Part 5:  
Steady-state temperature humidity  
bias life test**



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 60749-5:2003